

硅 Si 高性能雪崩光电二极管 (APD)



产品描述:

C30902EH高性能硅雪崩光电二极管(APD)的感光面直径为0.5 mm,适合于生物医学和分析应用。这种Si APD设计为 双扩散"穿透式"结构,可在400和1000 nm之间提供高响应度,以及在所有波长处都极快的上升和下降时间。

器件的响应度与最高约800 MHz的调制频率无关。探测器芯片采用经过修改的TO-18封装、密封在平玻璃窗后面。 多型号C30902EH/C30902EH-2 C30902SH C30902SH-TC

C30902和C30921系列

用于微光应用的高速固态探测器

C30902EH系列雪崩光电二极管非常适合广泛的应用,包括激光雷达、测距、小信号荧光、光子计数和条形码扫描。 Excelitas Technologies 的 C30902EH 系列雪崩光电二极管采用双扩散"穿透"结构制造。这种结构在400到1000纳米之 间提供了高响应度,并且在所有波长上都提供了极快的上升和下降时间。该器件的响应度与高达800 MHz的调制频率无 关。探测器芯片密封在一个改进的TO-18封装的平板玻璃窗后面。感光表面的有效直径为0.5 mm。

C30921EH封装在TO-18光管中,该光管允许从聚焦点或直径高达0.25mm的光纤将光有效耦合到探测器。密封的 TO-18封装允许光纤与光管端部匹配,以最大限度地减少信号损失,而无需担心危及探测器稳定性。C30902EH-2或 C30902SH-2 (带内置905nm通带滤波器的密封TO-18封装) 和C30902BH (带密封球透镜) 构成了C30902系列。

C30902SH和C30921SH均选用具有极低噪声和体暗电流的C30902EH和C30921EH光电二极管。它们适用于超微光级 应用(光功率小于1 pW),可在增益高达250或更高的正常线性模式(VrVbr)下的光子计数器使用,其中单个光电子可 触发约108个载波的雪崩脉冲。在这种模式下,不需要放大器,单光子检测概率可能高达约50%。

光子计数在门控和符合技术用于信号检索的情况下也是有利的。









产品特点:

- 高量子效率:在830 nm时为77%
- ☀ C30902SH和C30921SH可在盖革模式下运行
- ☀ C30902EH/SH-2型,带内置905 nm过滤器
- ☀ C30902BH型, 带球形透镜
- ☀ 密封包装
- 奎温下的低噪音
- 高响应度 内部雪崩增益超过150
- 🌞 光谱响应范围 (10%Q.E.点)400至1000纳米
- ☀ 时间响应 通常为0.5纳秒
- ☀ 宽工作温度范围-40°C至+70°C
- ☀ 符合RoHS标准

产品应用:

- 激光雷达
- 测距
- 小信号荧光
- 🌞 光子计数
- ☀ 条形码扫描

电光特性:

测试条件:外壳温度=22°C,除非另有规定,请参见下页的注释。









	C30902	EH/C309	02EH-2	C30902S	SH		C30902	SH-TC		
Detector Type	C30902BH			C30902SH-2		C30902SH-DTC				
, ,	C30921	EH		C309215	SH					
Parameter	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	Units
感光区										
有效直径		0.5			0.5			0.5		mm
active area		0.2			0.2			0.2		mm²
光管特性 (C30921)										
光管数值孔径		0.55			0.55					[no units]
岩芯折射率 (n)		1.61			1.61					[no units]
芯径		0.25			0.25					mm
视野 α										
带标准/球形透镜窗口		90			90			122		Degrees
(-2) 内置905 nm滤光片		55			55			N/A		Degrees
带灯管 (在空气中)		33			33			N/A		
Field of view α'										
带标准窗口/球透镜		114			114			129		Degrees
(-2) 内置905nm滤光片		78			78			N/A		
击穿电压, Vbr		225			225			225		V
反向偏置温度系数,Vr,恒定增益电压	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	V/°C
探测器温度										
-TC								0		°C
-DTC								-20		°C
Gain		150			250			250		
响应度										
830 nm时 (不适用于-2)	70	77		117	128			128		A/W
at 900nm	55	65		92	108			108		A/W
量子效率										
at 830 nm		77			77			77		%
at 900 nm		60			60			60		%
Dark current, id		15	30		15	30		15	30	nA
-TC (at 0°C)								2		nA
-DTC (at -20°C)								1		nA
Noise current, in		0.23	0.5		0.11	0.2				pA/ Ö Hz
-TC (at 0°C)								0.04		pA/ Ö Hz
-DTC (at -20°C)								0.02		pA/ Ö Hz
电容		1.6	2		1.6	2		1.6	2	pF
量子效率										
at 830 nm		77			77			77		%
at 900 nm		60			60			60		%
Dark current, id		15	30		15	30		15	30	nA





量子效率							
at 830 nm (not applicable for -2)	77		77		77		%
at 900 nm	60		60		60		%
Dark current, id	15	30	15	30	15	30	nA
-TC (at 0°C)					2		nA
-DTC (at -20°C)					1		nA
Noise current, in	0.23	0.5	0.11	0.2			pA/ Ö Hz
-TC (at 0°C)					0.04		pA/ Ö Hz
-DTC (at -20°C)					0.02		pA/ Ö Hz
电容	1.6	2	1.6	2	1.6	2	pF
Rise/Fall time, RL=50 Ω							
10% to 90% points	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	ns
90% to 10% points	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	ns
最大驱动电流							
-TC						1.8	A
-DTC						1.4	A
最大偏置电压							
-TC						0.8	V
-DTC						2.0	V
5%光子检测时的暗计数率			5000	15000	1100(-TC)		
probability (830 nm)					250(-DTC)	15000	cps
电压高于Vbr,光子探测概率为5%(830nm)			2		2		V
5%光子检测时的脉冲比后概率(830nm)			2	15	2		%

1.在特定直流反向工作电压下, Vop或Vr, 随每个装置提供, 光斑直径为0.25mm (C30902EH, SH) 或0.10mm (C30921EH, SH)。在180至250V的电压下运行,设备将满足上述电气特性限制。

2.热敏电阻的温度 (开尔文) 可为

使用以下方程式计算: [K] = β

项次(R/R∞)

式中, R是测量的热敏电阻电阻, 单位为Ω,

β = 3200, R0=5100 Ω, T0=298.15 K Ωr ∞ =

-βRe ≈=0.1113

表2-最大额定值

1.雪崩光电二极管中散粒噪声电流的理论表达式为in=(2q(Ids+(IdbM²+PORM)F)BW)½,其中q是电子电荷,Ids 是暗表面电流, Idb是暗体电流, F是过量噪声系数, M是增益, PO是器件上的光功率, BW是噪声带宽。对于这些装置, F=0.98 (2-1/M) +0.02 M (参考文献: PP Webb, RJ McIntyre, JJ Conradi, "RCA审查"。

2.C30902SH和C309021SH可在更高的检测概率下运行。(参见盖革模式操作部分)。

3.主脉冲后1µs至60秒发生脉冲后。









Parameter	Symbol	Min	Max	Units
储存温度	TS	-60	100	° C
工作温度	Тор	-40	70	° C
Soldering for 5 seconds (leads only)			260	° C
焊接5秒钟 (仅限引线)				
室温反向电流			200	μΑ
平均值,连续运行			1	mA
峰值 (1s持续时间, 非重复)				
室温正向电流			5	mA
平均值,连续运行			50	mA
峰值 (1s持续时间, 非重复)			60	mW

电光特性:

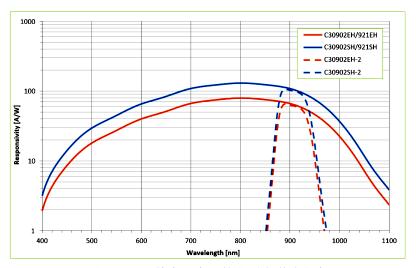


图1-22°C外壳温度下的典型光谱响应度

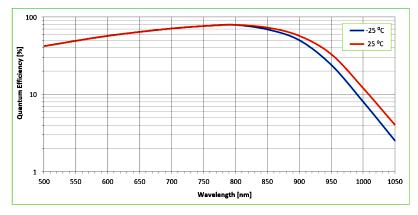


图2-典型量子效率与波长的关系,作为外壳温度的函数

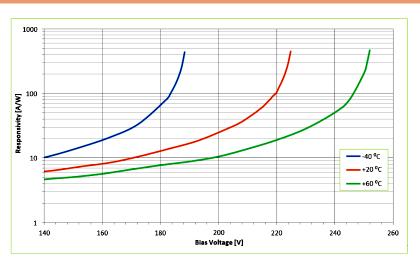


图3-830nm处的典型响应度与工作电压(作为外壳温度的函数)

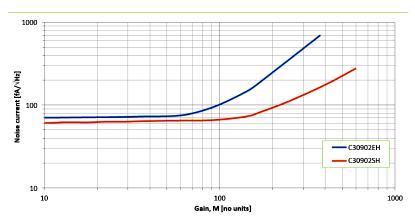


图4-典型噪声电流与增益

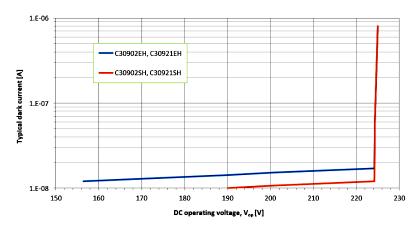


图5-典型暗电流与工作电压 外壳温度为22°C

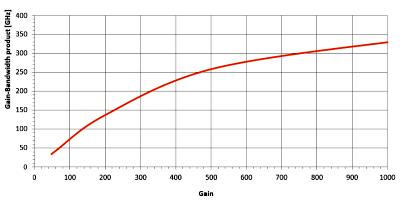


图6-典型增益-作为增益函数的带宽乘积 外壳温度为22°C

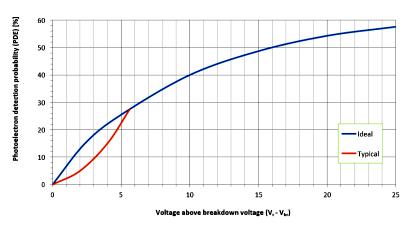


图7-盖革模式,830nm处光电子探测概率作为高于Vbr电压的函数 外壳温度为22°C

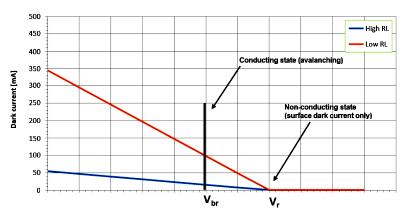


图8-盖革模式下C30921SH的载重线

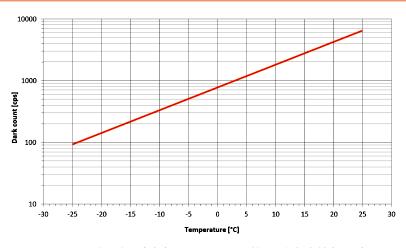


图9-5%光子探测效率 (830nm) 下的典型暗计数与温度

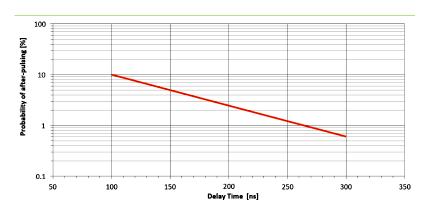


图10-有源淬火电路中下一个100ns内的后脉冲概率与延迟时间 (典型用于Vbr下的C30902SH和C30921SH, 外壳温度为22°C时)

包装图纸(其他包装可根据要求提供)

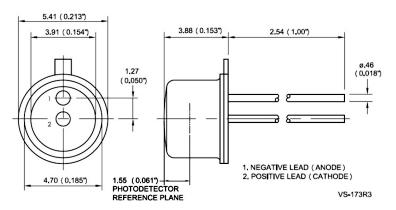


图11 - C30902EH和C30902SH,参考尺寸以毫米 (英寸) 为单位

图12-C30921EH和C30921EH, 灯管的包装轮廓和剖面,参考尺寸 以毫米[英寸]为单位显示

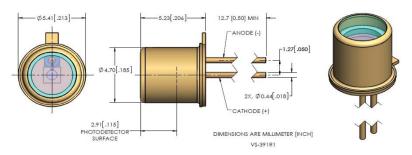


图13 - C30902EH-2和C30902SH-2所示参考尺寸,单位为毫米[英寸]

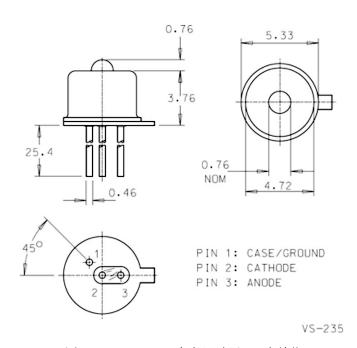


图14-C30902BH,参考尺寸以mm为单位

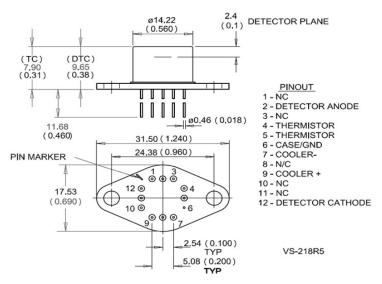


图15 - C30902SH-TC/-DTC, TO-66, 带法兰轮廓, 参考尺寸以毫米 (英寸) 为单位

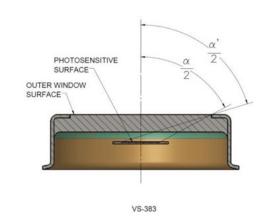


图16-近似视野-C30902和C30921系列 角入射辐射≤a/2、感光面完全发光 入射辐射角度>a/2、但是≤a/2、感光面部分发光

"-TC"和 "-DTC" TE冷却版本

TE冷却的APD可用于不同的原因(图15)。大多数应用程序得益于-TC(单)或-DTC(双)版本,

原因有二: 1.如前所述,降低用于非常小信号检测的热噪声。TC版本设计用于将APD运行至0C而-DTC版本可在-20 下运行℃当环境温度为22℃时℃。

2.无论环境温度如何,保持恒定的APD温度。由于APD击穿电压随温度降低而降低,TE冷却器允许单一工作电压。 此外,这种配置允许在扩展的环境温度范围内保持恒定的APD性能。装置内的热敏电阻可用于监测APD温度,并可 用于实施TE冷却器反馈回路,以保持APD温度恒定或/和对APD偏置电压进行温度补偿。需要一个合适的散热器来散 热APD和TE冷却器产生的热量。

定制设计,认识到不同的应用程序有不同的性能要求,Excelitas为这些APD提供了广泛的定制,以满足您的设计挑战。 暗计数选择、自定义设备测试和打包是许多应用程序特定的解决方案之一。盖革模式操作,当偏置电压高于击穿电 压时,雪崩光电二极管通常会传导大电流。但是,如果电流限制在小于特定值(约50对于这些二极管),电流不稳 定,可以自行关闭。对这一现象的解释是,在任何时候,雪崩区的载流子数量都很小,而且波动很大。如果数字恰 好波动到零,电流必须停止。If随后保持关闭状态,直到雪崩脉冲被大块或光生载流子重新触发。



选择"S"型以产生小批量暗电流。这使得它们适用于盖革模式下低于VBR的低噪声操作或高于VBR的光子计数。在 这种所谓的盖革模式中,单个光电子(或热产生的电子)可触发雪崩脉冲,使光电二极管从其反向工作电压Vr放电 到略低于VBR的电压。该雪崩发生的概率如图7所示为"光电子检测概率",可以看出,它随着反向电压Vr的增加而 增加。对于给定的Vr Vbr 值,光电子探测概率与温度无关。为了确定光子探测概率,需要将光子探测概率乘以量子 效率,如图2所示。量子效率也相对独立于温度,除了在1000 nm截止附近。

"S"型可在盖革模式下使用"无源"或"有源"脉冲熄灭电路。下面讨论每种方法的优缺点。

无源熄灭电路 最简单的,在许多情况下是一种完全合适的熄灭击穿脉冲的方法,是通过使用限流负载电阻器。这 种"被动"淬火的示例如图17所示。电路的负载线如图8所示。要在Vbr下处于导通状态、必须满足两个条件: 1.雪 崩必须由进入二极管雪崩区的光电子或体产生的电子触发。(注: 硅中的空穴在开始雪崩时效率很低。)上面讨论 了触发雪崩的概率。

3.为了继续处于导电状态,必须有足够大的电流(称为闭锁电流ILATCH)通过器件,以便在雪崩区域始终存在电子 或空穴。通常在C30902SH和C30921SH中,ILATCH=50uA.对于远大于ILATCH的电流(Vr Vbr)/RL、二极管保持导 通。如果电流 (Vr Vbr) /RL远小于ILATCH,则二极管几乎立即切换到非导通状态。如果 (Vr Vbr) /RL近似等于 ILATCH,则二极管将在任意时间从导通状态切换到非导通状态,这取决于雪崩区域中的电子和空穴数量统计波动 到零的时间。当RL较大时,光电二极管正常导通,且在非导通状态下工作点位于Vr IDSRL。雪崩击穿后,该器件以 时间常数RLC重新充电至电压Vr-IDSRL, 其中C是包括杂散电容在内的总器件电容。使用C=1.6 pF和RL=200 k充电时 间常数为0.32us是计算出来的。上升时间很快,为5到50ns、随着Vr-Vbr的增加而减少,并且非常依赖于负载电阻器、 引线、电容器的电容。

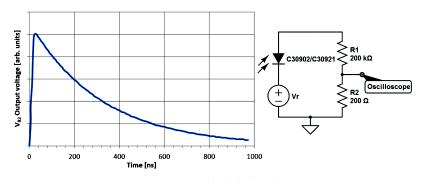


图17-无源淬火电路示例

主动淬火电路

在C30902SH充电之前,检测到另一个入射光电子的概率相对较低。为避免在高于Vbr的大电压下运行时出现过多死 区,可使用"主动淬火"电路。在检测到雪崩放电后,电路会暂时将偏置电压降低几分之一微秒。这个延迟时间允 许收集所有电子和空穴,包括那些暂时"捕获"在硅中不同杂质位置的电子和空穴。当重新施加更高的电压时,耗 尽区中没有电子触发另一次雪崩或锁定二极管。通过一个小的负载电阻,充电可以非常迅速。或者,可以保持偏置 电压,但负载电阻器由晶体管替换,该晶体管在雪崩后短时间保持关闭,然后开启一段足以对光电二极管充电的时 间。

定时分辨率

对于光子计数应用,当在曲线上绘制并平均半高宽时,检测到光子后TTL触发脉冲的时间是计时分辨率或时间抖动。 半电压点处的抖动通常与上升时间的数量级相同。对于必须具有最小抖动的定时目的,应使用上升脉冲的最低可能 阈值。



脉冲后

后脉冲是继光子产生的脉冲之后并由其诱导的雪崩击穿脉冲。后脉冲通常由雪崩期间通过二极管的大约108个载波之 一引起。如前所述,该电子或空穴被捕获并捕获在硅中的某个杂质位置。当这个电荷载体被释放时,通常在不到100 纳秒但有时几毫秒之后,它可能会开始另一次雪崩。使用图17所示的电路,在高于Vbr 2伏时,超过1微秒后出现后 脉冲的概率通常小于1%。

后脉冲随偏压的增大而增大。如果需要减少后脉冲,建议将Vr Vbr保持在低水平,使用具有长延迟线的主动淬火电 路,或具有长RLC常数的被动淬火电路。杂散电容也必须最小化。在某些情况下,可以对信号进行电子选通。如果 在特定应用中后脉冲是一个严重的并发症、可以考虑在Vbr以下使用良好的放大器进行操作。

暗电流

已选择"S"版本以具有较低的暗计数率。冷却至-25由于暗计数率对温度的依赖性是指数性的,因此C可以将其降低 约50倍。

暗计数随着电压的增加而增加,其曲线与光电子检测概率相同,直到电压在脉冲后产生反馈机制,从而显著增加暗 计数率。该最大电压取决于电路、除表1中列出的值外、不受保证。在大多数情况下、延迟时间为300纳秒、二极管 可在高达Vbr+25V的电压下有效使用。

C30902不应向前偏置,或者在无偏置时,不应暴露在强照明下。这些条件导致暗计数大大增强,可能需要24小时才 能恢复到其标称值。

RoHS合规性

C30902和C30921系列雪崩光电二极管的设计和制造完全符合欧盟指令2011/65/EU-限制在电气和电子设备中使用某 些有害物质 (RoHS)。

担保

装运后的标准12个月保修适用。如果光电二极管窗口已打开,则任何保修均无效。

关于Excelitas Technologies

Excelitas Technologies是一家全球技术领导者,致力于提供创新的定制解决方案,以满足OEM客户的照明、检测和其 他高性能技术需求。

从PerkinElmer、EG&G和RCA开始,Excelitas在45年多的时间里一直为我们的OEM客户群提供光电传感器和模块服务。 我们始终致力于创新、致力于为全球客户提供最优质的解决方案。

从航空航天和国防到分析仪器、临床诊断、医疗、工业以及安全和安保应用, Excelitas Technologies致力于帮助我们 的客户在其专业终端市场取得成功。Excelitas Technologies在北美、欧洲和亚洲拥有约3000名员工,为全球客户提供 服务。





